DIN 51390-4:2000-11 (D)

Prüfung von Mineralölerzeugnissen - Bestimmung des Siliciumgehaltes - Teil 4: Direkte Bestimmung durch optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv angekoppeltem Plasma (ICP OES)

Inhalt		Seite
Vorwort		1
1 Anwendungsbereich		1
2 Normative Verweisungen		1
3 Einheit		1
4 Prinzip		2
5 Bezeichnung		2
6 Geräte		2
7 Chemikalien		2
8 Aufstellen der Silicium-Bezugskurve		2
9 Probenvorbereitung		2
10 Durchführung		2
11 Auswertung		2
12 Angabe der Ergebnisse		3
13 Präzision des Verfahrens		3
13.1 Wiederholbarkeit (<i>r</i>)		3
13.2 Vergleichbarkeit (<i>R</i>)		3